



NATIONAL  
INSTRUMENTS™



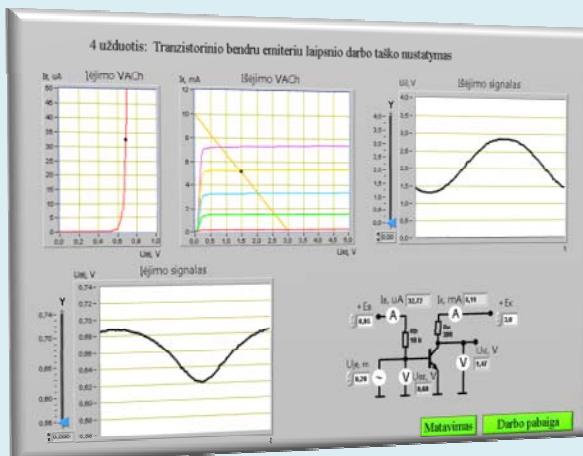
Vilniaus  
pedagoginis  
universitetas



Московский государственный институт радиотехники,  
электроники и автоматики (технический университет)

Факультет информатики • Кафедра информационных систем

## LabVIEW Elektronikos praktiniai darbai



NATIONAL INSTRUMENTS  
LabVIEW™

S. Borodinas, V. Batovrin, A. Romanov



Leidinys apsvarstytas Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakulteto Bendrosios technologijos katedros posėdyje 2009 m. gegužės 26 d. (protokolo Nr. 4), Vilniaus pedagoginio universiteto Fizikos ir technologijos fakulteto tarybos posėdyje 2009 m. birželio 15 d. (protokolo Nr. 09-05-06) ir rekomenduotas spausdinti.

## **PRATARMĖ**

Mokymo priemonėje pateiktas LabVIEW analoginės ir skaitmeninės elektronikos praktiniai laboratoriniai darbai, atliekami naudojant virtualiuosius prietaisus. Knyga skirta studentams, besimokantiems pagal bakalaurų rengimo programą, diplomuotiems elektro ninių prietaisų gamybos specialistams ir magistrantams, studijuojantiems discipliną „Elektronika ir mikroprocesorinė technika“. Knyga, kaip gretutinių disciplinų vadoveliu, gali naudotis ir kitų krypčių bei specialybų studentams, todėl visi laboratoriniai darbai pradedami trumpu teoriniu įvadu.

Šis vadovėlis – bendras VPU FTF doc. S. Borodino ir Maskvos Radiotechnikos, Elektronikos ir Automatikos institutų – MIREA – katedros vedėjo prof. V. Batovrino bei doc. A. Bessonovo ir V. Moshkino leidinys. Autoriai dėkoja *National Instruments* atstovui Lietuvoje „J. ir A. Romanovų“ Pl, VPU FTF darbuotojui A. Stasiukynui už vertingas pastabas terminijos klausimais.

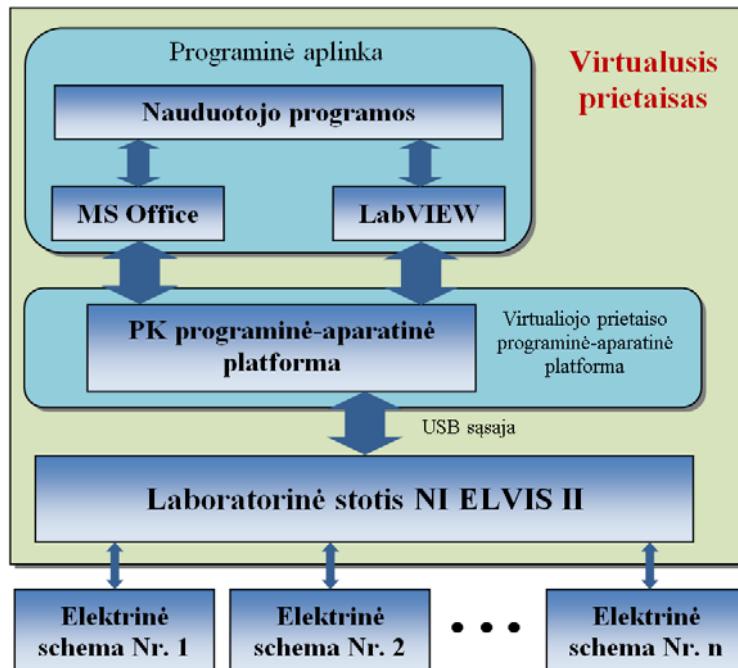
## **IŽANGA**

Taikant šiuolaikines informacines technologijas atsiranda daugiau galimybių sukurti naujas mokymo priemones ir naujus metodus. Vienas iš svarbiausių ir sunkiai išsprendžiamų uždavinių – sukurti kompiuterinę laboratorinę praktiką.

Bet kurios disciplinos laboratorinės praktikos pagrindą sudaro matavimo priemonių kompleksas, sujungtas su laboratoriniais maketais, kuriuos naudojant atkuriama nagrinėjami reiškiniai ir procesai. Iki šiol mokymo laboratorijoje dažniausiai buvo naudojami tradiciniai matavimo prietaisai. Šiuolaikiška tendencija tampa mokymo tikslais panaudoti kompiuterines matavimo priemones, sukurtas taikant virtualių prietaisų technologiją. Virtualusis prietaisas (VP) mokymo laboratorijoje – tai matavimo priemonė, dažniausiai personalinis kompiuteris, turintis papildomų specialių programų ir įvairių matavimo modulių, pavyzdžiui, daugiafunkcinę įvedimo ir išvedimo plokštę. VP gali automatizuoti matavimo informacijos

surinkimo, apdorojimo ir pateikimo operacijas, turi patogų vartotojo aplanką, o jo programinės ir aparatinės priemonės atlieka funkcijas, būdingas tradicinėms matavimo priemonėms, ir leidžia pateikti rezultatus vaizduoklio ekrane patogia naudotojui forma. VP schema, naudojama laboratorinėje praktikoje, parodyta 1 pav.

Programinė VP įranga gali būti įdiegama ir standartinėmis



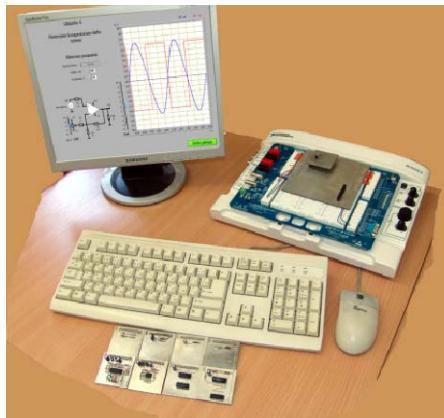
1 pav. Virtualiojo prietaiso struktūra

priemonėmis, tokiomis kaip *Visual C ++*, *Visual Basic* ir pan., ir pasitelkiant programines priemones, specialiai skirtas matavimo informacijos surinkimo, pertvarkymo ir apdorojimo užduotims spręsti. Šiandien tarp tokiuų specializuotų programinių priemonių labiausiai tinkamu galima laikyti kompanijos *National Instrument* programinį paketą *LabVIEW*.

Rinkoje atsiradę prietaisai, skirti matavimo procesams ir procedūroms automatizuoti, beveik visada komplektuojami *LabVIEW* programine aplinka. Programinė įranga šioje programinėje aplinko-

je kuriamą vizualiomis priemonėmis. Tai nereikalauja iš kuriančiojo išsamių programavimo žinių.

Laboratoriniams darbams atlikti reikės bazinio laboratorinio stendo, turinčio šiuolaikinį asmeninį kompiuterį (AK), į kurį įdiegta operacine sistema *Windows 9x* ar naujesne versija, specializuotu prietaisų komplektu ir originalia programine įranga.



2 pav. Laboratorinio stendo vaizdas

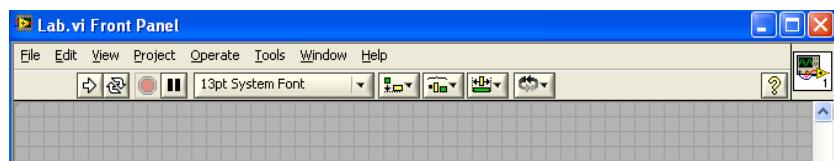
Pasirinkta laboratorinė specializuotų prietaisų stotis NI ELVIS II. Stendas komplektuojamas iš laboratorinių modulių, kuriuose surinktos tiriamosios schemas, rinkinio. Atliekant laboratorinius darbus, atitinkami moduliai įstatomi į laboratorinės stoties NI ELVIS II pereinamosios plokštės lizzdus. Laboratorinio stendo vaizdas parodytas 2 pav.

Laboratorinio darbo stoties parengimo tvarka ir darbo su LabVIEW programine įranga instrukcija pateiktos priede ir prie knygos pridedamame kompaktiniame diske.

Pagrindinis valdymo langas vaizduoklyje lemia išorinį VP vaizdą ir patogų valdymą. Valdymo lange išdėstyti įvairūs VP valdymo elementai (jungikliai, mygtukai, įvedimo langai ir t. t.) ir matavimo rezultatų pavaizdavimo elementai (skaitmeniniai indikatoriai, grafiniai ekranaai ir t. t.). Pateiktas naudotojo valdymo langas yra gana paprastas, todėl užduotims atlikti reikia tik įprastinių dar-

bo su personaliniu kompiuteriu įgūdžiu. Norint sėkmingai atlikti darbą reikia suprasti laboratorinio darbo tikslus ir užduotis.

Ruošiantis atlikti darbą, reikia atkreipti dėmesį į klausimus iš skyriaus „TEORINĖ DALIS“, esančio kiekviename darbe. Be šio teorinio įvado, būtina dar išnagrinėti nurodytus užduotyje pagrindinės literatūros skyrius, o, reikalui esant, naudinga pasinaudoti ir papildoma literatūra. Pagrindinės ir papildomos literatūros sąrašai pateikti vadovėlio gale.



3 pav. LabVIEW programos atidaryto lango vaizdas

Prieš atliekant laboratorinį darbą, pirmiausia reikia įjungti kompiuterį, visais atvejais būtina atidaryti programinės įrangos aplanką ir įkrauti laboratorinio darbo programą (dvigubas spragtelėjimas ant failo **Lab-n.vi**, kur **n** – darbo numeris). Vaizduoklio ekrane atsidarys langas, kurio vaizdas parodytas 3 pav.

Programa paleidžiama, nuspaudus mygtuką RUN su pavaizduota strėle .

Be to, prieš atliekant laboratorinį darbą būtina susipažinti su skyriumi „LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS“ ir nuosekliai atlikti visus nurodymus, pateiktus skyriuje „DARBO UŽDUOTIS“. Atliekant užduotį, vaizduoklio ekrane gali atsirasti papildomų nuorodų. Gautus matavimo ir stebėjimo rezultatus galima iškart įvesti į ataskaitą. Tam tikslui patogu naudotis tekstiniu redaktoriu MS Word. Numatoma, kad studentai moka pagrindinius teksto sudarymo ir apdorojimo, lentelių sudarymo ir formatavimo metodus.

Atliekant užduotį, rekomenduojama orientuotis į tekste nurodytas elektrinių parametrų vertes. Galimi ir nedideli ( $\pm 10\%$  ribose) nukrypimai nuo rekomenduojamų reikšmių. Reikia pažymeti, kad su naudojamais maketais, pakeitus programinę įrangą, galima atlikti ir papildomus tyrimus. Tokių darbų tikslus ir tvarką turi nustatyti

dėstytojas, įvertindamas NI ELVIS II įvedimo ir išvedimo laboratorinės stoties galimybes.

Atlikto darbo ataskaitos sudarymo patogumui aprašyme pateikiame rekomenduojami lentelių tipai ir nurodymai, kaip išsaugoti eksperimentinius duomenis elektronine forma.

Darbo ataskaita pateikiama rekomenduojama forma, kurią gali koreguoti dėstytojas arba laboratorinio darbo vadovas.

## TURINYS

<b>PRATARMĖ .....</b>	<b>3</b>
<b>IŽANGA .....</b>	<b>3</b>
<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 1.....</b>	<b>12</b>
PUSLAIDININKINIŲ DIODŲ IR STABILITRONŲ TYRIMAS .....	12
1.  DARBO TIKSLAI .....	12
2.  TEORINĖ DALIS .....	12
3.  LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....	19
4.  DARBO UŽDUOTYS .....	19
1 užduotis. Lygintuvininio diodo voltamperinės charakteristikos tyrimas .....	20
2 užduotis. Stabilitrono voltamperinės charakteristikos tyrimas .....	22
3 užduotis. Vieno pusperiodžio puslaidininkininio lygintuvo tyrimas.....	23
5.  KONTROLINIAI KLAUSIMAI .....	24
<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 2.....</b>	<b>25</b>
TIRISTORIAUS IR VALDOMO LYGINTUVO CHARAKTERISTIKŲ	
TYRIMAS.....	25
1.  DARBO TIKSLAI .....	25
2.  TEORINĖ DALIS .....	25
3.  LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....	32
4.  DARBO UŽDUOTYS .....	33
1 užduotis. Tiristoriaus VACh tyrimas .....	34
2 užduotis. Tiristoriaus statinių charakteristikų šeimos gavimas.....	36
3 užduotis. Valdomo vieno pusperiodžio lygintuvo tyrimas .....	37
5.  KONTROLINIAI KLAUSIMAI .....	38
<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 3.....</b>	<b>39</b>
TUNELINIO DIODO VOLTAMPERINĖS CHARAKTERISTIKOS	
TYRIMAS.....	39
1.  DARBO TIKSLAI .....	39
2.  TEORINĖ DALIS .....	39
3.  LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....	43

4.	<i>DARBO UŽDUOTYS</i> .....	43
1	užduotis. Tunelinio diodo VACh stebėjimas.....	44
2	užduotis. Tunelinio diodo VACh matematinio modelio sudarymas.....	46
3	užduotis. Rezultatų išsaugojimas.....	48
4	užduotis. Tunelinio diodo elektrinių parametru nustatymas .....	49
5.	<i>KONTROLINIAI KLAUSIMAI</i> .....	49
	<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 4.....</b>	<b>50</b>
	<b>DVIPOLIO TRANZISTORIAUS CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS.....</b>	<b>50</b>
1.	<i>DARBO TIKSLAI</i> .....	50
2.	<i>TEORINĖ DALIS</i> .....	50
3.	<i>LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....</i>	59
4.	<i>DARBO UŽDUOTYS</i> .....	59
1	užduotis. Dvipolio tranzistoriaus nuolatinės srovės perdavimo koeficiente nustatymas.....	61
2	užduotis. Dvipolio tranzistoriaus jėjimo charakteristikos nustatymas schema su bendru emiteriu.....	61
3	užduotis. Dvipolio tranzistoriaus išėjimo charakteristikų šeimos nustatymas schema su bendru emiteriu .....	62
4	užduotis. Tranzistorinio laipsnio su bendru emiteriu darbinio taško nustatymas .....	64
5.	<i>KONTROLINIAI KLAUSIMAI</i> .....	66
	<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 5.....</b>	<b>67</b>
	<b>LAUKO TRANZISTORIAUS CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS.....</b>	<b>67</b>
1.	<i>DARBO TIKSLAI</i> .....	67
2.	<i>TEORINĖ DALIS</i> .....	67
3.	<i>LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....</i>	74
4.	<i>DARBO UŽDUOTYS</i> .....	74
1	užduotis. Lauko tranzistoriaus perdavimo charakteristikos gavimas schema su bendra ištaka.....	75
2	užduotis. Lauko tranzistoriaus kanalo varžos priklausomybės nuo užtūros–ištakos įtampos grafiko sudarymas .....	77
3	užduotis. Lauko tranzistoriaus išėjimo charakteristikų šeimos matavimas bendrosios ištakos schema .....	78

4 užduotis. Tranzistorinio laipsnio su bendra ištaka darbo tyrimas .....	79
5. KONTROLINIAI KLAUSIMAI .....	81
<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 6.....</b>	<b>81</b>
SCHEMŲ SU OPERACINIAIS STIPRINTUVAIS TYRIMAS .....	81
1. DARBO TIKSLAI .....	81
2. TEORINĖ DALIS .....	82
3. LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....	92
4. DARBO UŽDUOTYS .....	92
1 užduotis. Invertuojančio stiprintuvo perdavimo charakteristikos gavimas .....	93
2 užduotis. Invertuojančio stiprintuvo darbo tyrimas .....	94
3 užduotis. Neinvertuojančio stiprintuvo perdavimo charakteristikos gavimas.....	96
4 užduotis. Neinvertuojančio stiprintuvo darbo tyrimas .....	97
5 užduotis. Įtampos integratoriaus darbo tyrimas.....	99
6 užduotis. Įtampos diferenciatoriaus darbo tyrimas.....	100
5. KONTROLINIAI KLAUSIMAI .....	102
<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 7.....</b>	<b>103</b>
ANALOGINIŲ ĮTAMPOS KOMPARATORIŲ CHARAKTERISTIKŲ TYRIMAS.....	103
1. DARBO TIKSLAI .....	103
2. TEORINĖ DALIS .....	103
3. LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....	110
4. DARBO UŽDUOTYS .....	111
1 užduotis. Vienaslenksčio komparatoriaus perdavimo charakteristikos gavimas.....	112
2 užduotis. Vienaslenksčio komparatoriaus darbo tyrimas .....	114
3 užduotis. Histerezinio komparatoriaus perdavimo charakteristikos gavimas.....	115
4 užduotis. Histerezinio komparatoriaus darbo tyrimas.....	116
5. KONTROLINIAI KLAUSIMAI .....	117

<b>LABORATORINIS MODULIS NR. 8.....</b>	<b>118</b>
SKAITMENINIŲ SCHEMU TYRIMAS .....	118
1. DARBO TIKSLAI .....	118
2. TEORINĖ DALIS .....	118
3. LABORATORINIO STENDO APRAŠYMAS.....	128
4. DARBO UŽDUOTYS .....	128
1 užduotis. Skaitmeninių loginių elementų tyrimas.....	128
2 užduotis. Dešifratoriaus $2 \times 4$ darbo tyrimas.....	129
3 užduotis. Multipleksoriaus $4 \times 1$ darbo tyrimas.....	130
4 užduotis. Asynchroninio RS trigerio darbo tyrimas.....	132
5 užduotis. Dviejų pakopų JK trigerio darbo tyrimas .....	133
6 užduotis. Dviejų pakopų D trigerio darbo tyrimas .....	135
7 užduotis. Skaičiuojančio T trigerio darbo tyrimas.....	136
8 užduotis. Asynchroninio dvejetainio skaitiklio darbo tyrimas.....	137
9 užduotis. Asynchroninio skaitiklio su perskaičiavimo koeficientu 10 darbo tyrimas.....	139
5. KONTROLINIAI KLAUSIMAI .....	140
PRIEDAS .....	141
LITERATŪRA .....	145